

High-speed data recording

[We have the software of the English version.]

印刷プレビュー

2008/06/06 11:30:10

エレクトロケミカルマイグレーション試験データ

CH5 :

DCバイアス電圧	30.0 V	試験名称	fast			
データ収録間隔	1 分	メモ				
ECM判定閾値 レベル①	1.000E+006Ω	試験期間	開始	2008/06/06 10:51:25	終了(予定)	2008/06/06 11:51:25
ECM判定閾値 レベル②	2.000E+005Ω	試験時間	経過	0時間3分	合計	1時間0分

It catch a resistance value change between only 49msec, and an examination is finished immediately

Data	Time(sec)	Time(hh:mm:ss)	DC Bias(V)	Current(A)	Resistance(ohm)
1	10.073	00:10.1	29.99976	6.72E-08	4.47E+08
2	60.004	01:00.0	29.99982	8.15E-08	3.68E+08
3	120.007	02:00.0	29.99982	1.11E-08	4.22E+08
4	180.011	03:00.0	29.99982	1.09E-08	3.71E+08
5	219.804	03:39.8	11.60268	3.26E-05	9.12E+05
6	219.853	03:39.9	11.60268	6.54E-05	1.77E+05

It records without missing a leak touch !
Because it can stop BIAS immediately, it prevent a damage of dendrite !

* The most speed is 16msec

試験名称とメモを削除